

## 偏心シャフト径用 インプロセス測定システム

シンプルでコンパクトかつフレキシブルな、Fenar X ゲージングシステムは、切欠きの無い偏心シャフト径用のオービット研削盤上における各種アプリケーションに対応する事が可能です。Fenar X の追従システムにより、300rpm以下の回転速度にて、偏心動作する径の連続モニタリングをします。その信頼性及び強靭さと高精度は、小型偏心ワーク研削に適しています。

### 主な特徴

- コンパクト
- 広い測定範囲
- 高精度
- 高い柔軟性

Measuring Heads

Electronic Units

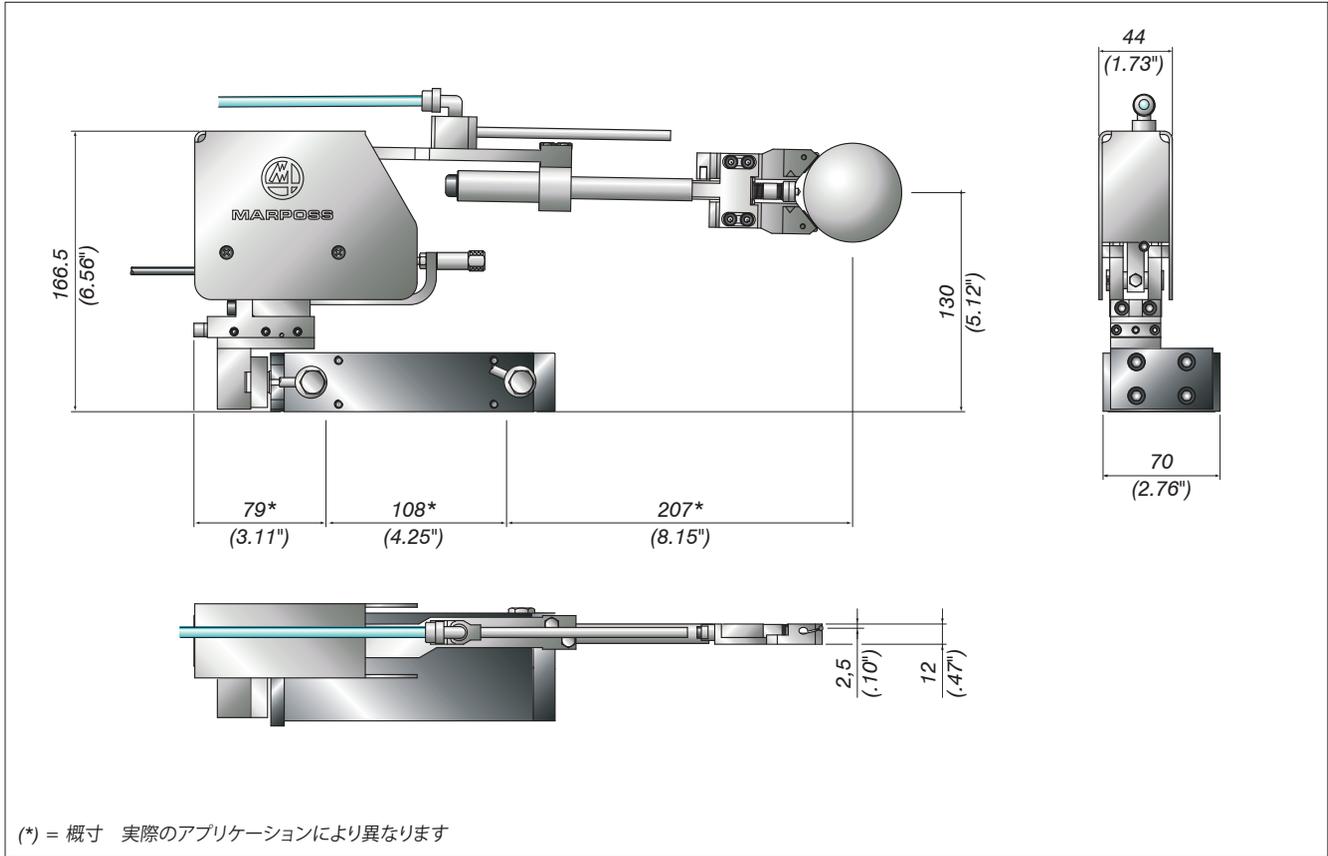
Balancing Heads

Software

Sensors

Accessories

# 仕様および外形図



## 技術仕様

### Fenar X のアプリケーション範囲

直線性	±2000 μm (.08")
感度誤差	±6%
繰り返し精度 メカ部の分解能が 0.1 μm (.000004")の場合	≤0.8 μm (.00003")
温度ドリフト	≤0.3 μm/°C (.000007"/°F)
最大回転速度	300 rpm
測定可能径	12~40 mm (.47"~1.58")
最大ストローク	21 mm (.79")
ワーク面	切欠きなし

### スナップゲージ部のアプリケーション範囲

<b>作動範囲 25 mm (.98")</b> 一個のスナップゲージにて作動範囲内のメインジャーナルとピンジャーナルを測定します。研削するそれぞれの径のマスターにて自動的にゼロセットをします。	分解能 1 μm (.00004")
<b>作動範囲 12,5 mm (.49")</b> 双頭磁石仕様の研削盤にて作動範囲内のメインジャーナルとピンジャーナルを専用のスナップゲージにて測定します。研削するそれぞれの径のマスターにて自動的にゼロセットをします。	測定範囲 1000 μm (.04")
	分解能 0,1 μm (.000004")
	測定範囲 500 μm (.02")

各国の住所一覧は、Marposs の公式ウェブサイトをご参照下さい。

D6101603J0 - Edition 09/2012 - お断りなく仕様の変更を行うことがあります。  
© Copyright 2012 すべての著作権はMARPOSS S.p.A. (Italy) にあります。

MARPOSS、<sup>®</sup> およびマーポス製品の名称/記号などは米国および各国におけるマーポスの登録商標あるいは商標です。また、本カタログ内に第三者の商標ならびに登録商標が記載されている場合、その権利は各社のものです。

Marposs の品質、環境、安全の統合管理システムは、ISO 9001, ISO 14001 および OHSAS 18001 の認証を取得しています。また、EAQF 94 資格と Q1 賞も授与されています。



www.marposs.com



本カタログのPDFファイルをダウンロードできます。